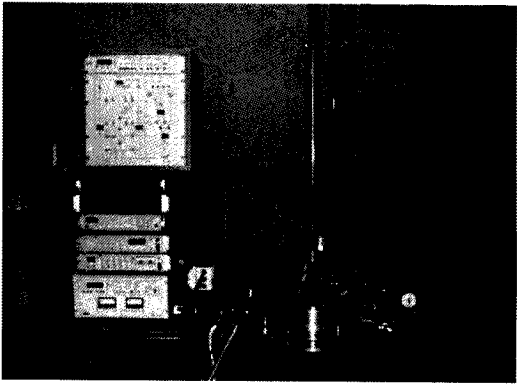
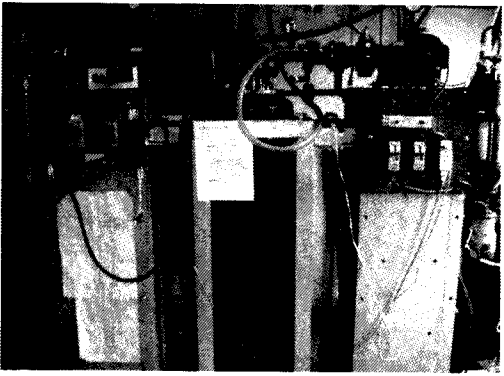


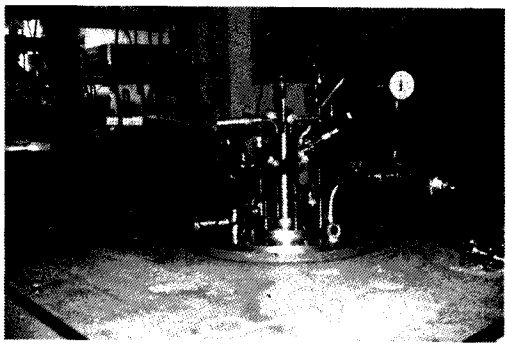
センターからのお知らせ

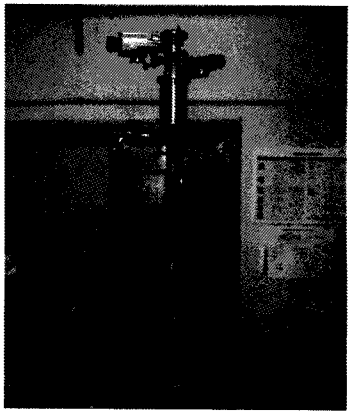
共同研究、共同利用設備一覧

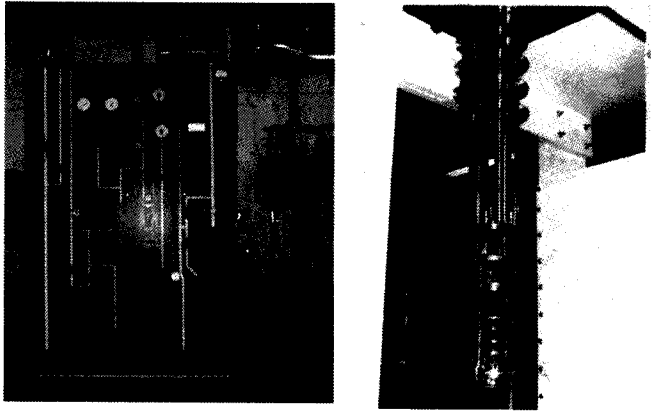
極低温科学センターでは、共同研究、共同利用実験のため、実験室に以下のような装置を提供しております。ここで「共同研究設備」とは本センター職員と共同で行う研究用の実験装置、「共同利用設備」とは基本的に利用者のみで実験を行う装置です。共同利用の装置は共同研究としてつかうことも可能です。共同研究および共同利用の申込法、マシンタイム、装置の詳しい性能等に関しましては、極低温科学センタースタッフ（極低温物理学部（青葉山）：内線 6476、低温科学部（片平）：内線 2167）にご相談ください。また装置に関係なく低温技術に関する相談にもできる限り応じております。どうぞお気軽に連絡ください。

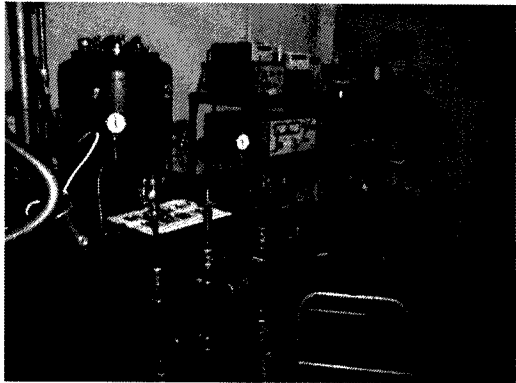
装置名	場所	分類
トップロード式希釈冷凍機システム	極低温物理学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 形式：トップロード方式 試料空間径：20 mm 最低到達温度：20 mK 最高磁場：17 T プローブ：試料回転装置付プローブ 圧力用プローブ 常圧、静水圧、一軸圧下で電気抵抗などの輸送現象、AC 帯磁率、dHvA 効果などの測定が可能です		


装置名	場所	分類
³ He クライオスタットシステム	極低温物理学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 最大磁場：8 T 最低温度：400 mK 電気抵抗、DC 磁化、AC 帯磁率が測定可能です。 （平成 15 年 6 月まで）		

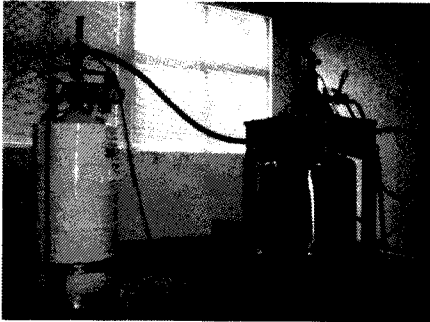
装置名	場所	分類
温度可変インサート&10T超伝導マグネットシステム	極低温物理学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 温度可変範囲：1.2K-300 K 試料空間径：30 mm 最大磁場：10 T 磁気抵抗が測定可能です。今年度中に AC 帯磁率の測定システムを立ち上げる予定です。		

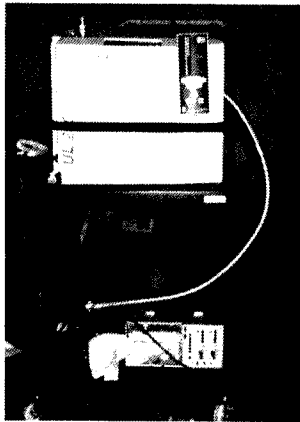
装置名	場所	分類
³ Heクライオスタットインサート	低温科学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 形式：トップローディング型 試料空間口径：25mmφ 最低到達温度：370 mK (ワンショット運転) 530 mK (連続運転) 最低温度到達時間：1.5K より 2 時間 低温科学部にある 9/11T 超伝導マグネット、およびファラデー型超伝導マグネット(8T)に挿入可能です。磁場中輸送特性用とファラデー法による DC 磁化測定が可能です。		

装置名	場所	分類
希釈冷凍機	低温科学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 SHE 社 最低到達温度：10mK 冷却能力：1 μW (11.4mK) 最大磁場：9T(4.2K)/10.5T(2.2K)		

装置名	場所	分類
ファラデー型超伝導マグネット	低温科学部	共同研究
装置の説明		
<p>装置仕様</p> <p>a. バックグラウンドマグネット 均一度：0.1%/cm 最大磁場：8T 口径：63.5mmφ</p> <p>b. グラディエントマグネット 最大磁場勾配：+/-6 T/m リニアリティ：+/-0.1%/cm DSV</p> <p>1-8T の磁場中で試料空間に一定の磁場勾配を作るマグネットです。³He クライオスタットインサートと組み合わせて磁化と電気抵抗、VTI (1.5-300K) と組み合わせて電気抵抗が測定可能です。</p>		
		

装置名	場所	分類
温度可変インサート&9/11T 超伝導マグネットシステム	低温科学部	共同利用
装置の説明		
<p>装置仕様</p> <p>a. Cryomagnetics 社製 NbTi マグネット 均一度：0.1%/cm (磁場安定性 1ppm/時間) 最大磁場：9T/11 T (11 T はラムダープレート使用時) 口径：63.5mmφ</p> <p>b. VTI (温度可変型インサート) 試料空間口径：45mmφ 温度可変領域：1.5K-325K (安定度 0.1K)</p> <p>磁場中輸送特性が測定可能です。</p>		
		

装置名	場所	分類
VSM 磁化測定装置	低温科学部	共同利用
装置の説明		
<p>装置仕様</p> <p>Oxford 社 MagLab^{VSM} 最大磁場：14 T 温度範囲：3.8-300 K ノイズレベル：2×10^{-6} emu(P to P) 分解能：1×10^{-8} emu</p> <p>最大 14T までの DC 磁化の温度、磁場依存性が自動測定できます。</p>		
		

装置名	場所	分類
リークディテクター	低温科学部	共同利用
装置の説明		
装置仕様 LEYBOLD 社 UL200 真空およびスニファーモードでの検出可能 最高検知感度： 5×10^{-11} mbar·l/s インレットポート圧力：2 mbar 以下 立ち上がり時間：3分以下 内蔵ポンプ：ロータリーポンプ ターボ分子ポンプ 排気性能：1 l/s 以上 (FINE) 0.3 l/s 以上 (GROSS) 重量：32 kg キャスター付		

装置名	場所	分類
試料評価用 X線回折装置	低温科学部	共同利用
装置の説明		
装置仕様 リガク社 RINT2100PC 最大出力：2kW (60 kV、50mA) 封入管式ターゲット ゴニオ部： $\theta/2\theta$ 運動、 θ 、 2θ 単独 (範囲： $2\theta = -60 \sim 158^\circ$ 精度： 0.002°) アライメント自動調整、 自動可変スリット モノクロメータ カウンタ：NaI シンチレータ (700000cps 以上) オプション：薄膜用回転試料台 ラウエカメラ (ポラロイドフィルム) 解析：自動ピークサーチ、多重ピーク分離、 定性分析 (PDF2 カード) 結晶系決定、格子定数精密化等		